

CALL FOR PAPERS



IWSM 2010
20th International Workshop
on Software Measurement



MetriKon 2010
DASMA Metrik Kongress



Mensura 2010
International Conference
on Software Process and Product Measurement

November 10-12, 2010, Stuttgart

von **DASMA** Deutschsprachige Anwendergruppe für
Software-Metrik und Aufwandschätzung
GI FG 2.1.10 GI Fachgruppe Software Messung und Bewertung
zusammen mit: **Canadian Interest Group on Metrics**
COMmon Software Measurement International Consortium
Metrics Associations International Network
Universität Magdeburg, Deutschland
École de Technologie Supérieure – Université du Québec, Kanada,
University of Alcalá, Madrid, Spanien

unterstützt von: **Vector Consulting Services, Stuttgart**

Hauptvorträge von: **Christof Ebert, Pekka Abrahamsson, Wai F. Hom**

Themenstellung & Abgrenzung

Software-Messverfahren und Metriken sind Schlüsseltechnologien für Controlling und Management des Softwareentwicklungs-Prozesses. Messen ist eine wichtige Grundlage für jede Ingenieur Tätigkeit und die Gewinnung neuer Erkenntnisse in Wissenschaft und Technik. Es ist damit sowohl für die Praxis der Software-Entwicklung als auch für die empirische Forschung zur Software-Technik unverzichtbar. Dem notwendigen Erfahrungsaustausch zwischen Theorie und Praxis bietet diese Tagung eine ideale Plattform.

Themenfelder

Gewünscht sind Beiträge aus allen Bereichen des Software-Messens, insbesondere zu:

Grundlagen der Softwaremessung	Unternehmensweite Lösungen
Messparadigmen	Kennzahlenbasierte Bewertung von Best Practices
Empirische Fallstudien	Produkt- und Prozessmetriken, z.B. für Sicherheit
Validierung von Metriken	Projektmanagement und IT-Governance
Software-Benchmarking	Messbasiertes Business-IT-Alignment
Messung funktionaler Größe	Praktische Messverfahren
Schätzverfahren	Messprozesse und -hilfsmittel
Prozessverbesserung	Datenbanken und Messwerkzeuge
Quantitatives und statistisches Management	Erfahrungen und Ausbildung
Six-Sigma-Techniken	Akzeptanz und Nutzung von Messungen

Einreichung

Autoren senden bitte ihren Beitrag als *Kurzfassung* (2-4 Seiten) per E-Mail bis zum ~~21. Juni~~ **30 Juni 2010** an:

metrikonpapers@dasma.org (offen ab 1. April 2010)

Gewünscht werden Erfahrungsberichte aus der industriellen Praxis oder der praxisorientierten Forschung. Die eingereichten Beiträge dürfen noch nicht an anderer Stelle veröffentlicht oder bei einer Zeitschrift oder einer anderen Tagung eingereicht worden sein. Mindestens einer der Autoren eines angenommenen Beitrages muss sich für den Kongress anmelden und die Präsentation des Beitrages sicherstellen.

Die abschließenden druckfertigen Beiträge müssen auf den MetriKon-Vorlagen und gemäß den „IWSM/MetriKon 2010 Richtlinien für Autoren“ aufgebaut sein (näheres dazu auf www.metrikon.de).

Kongress-Sprachen sind Englisch und Deutsch. Deutsche Vorträge werden in einer separaten Sitzungsreihe präsentiert.

Tutorien und Workshops

Angebote für die Durchführung von Mini-Tutorien oder Workshops, die in einer eigenen Sitzungsreihe während der Tagung angeboten werden, erbitten wir bis spätestens **2. August 2010**.

Ausstellung

Begleitend zur Tagung wird eine Ausstellung organisiert, in der Dienstleister und Werkzeughersteller den Teilnehmern ihre Angebote zur Unterstützung von Softwaremessung und Aufwandschätzung vorstellen. Interessenten erhalten nähere Informationen beim DASMA-Sekretariat.

Zeitplan der Tagung

Einreichung der Kurzfassung bis zum:	21. Juni 2010	verlängert bis 30. Juni 2010
Mitteilung über Annahme/Ablehnung:	02. August 2010	
Abgabe des vollständigen Beitrags bis zum:	20. September 2010	
Kongress-Datum:	10.-12. November 2010	

Programmkomitee

Alain Abran,
École de Technologie Supérieure, Montréal, Kanada

Günter Büren,
Büren & Partner, Nürnberg, Deutschland

Luigi Buglione,
Atos Origin, Italy / ÉTS, Kanada

Manfred Bundschuh,
DASMA, Deutschland

François Coallier,
École de Technologie Supérieure, Montréal, Kanada

Juan Cuadrado-Gallego,
Alcala University, Madrid, Spanien

Ton Dekkers,
Galorath International Limited, UK

Jean-Marc Desharnais,
École de Technologie Supérieure, Montréal, Kanada

Javier Dolado,
Universidad San Sebastian, Spanien

Axel Dold,
Daimler AG, Sindelfingen, Deutschland

Maria Jose Dominguez,
Aragon University, Spanien

Reiner Dumke,
Universität Magdeburg, Deutschland

Christof Ebert,
Vector Consulting, Stuttgart, Deutschland

Marian Fernandez de Sevilla,
Alcala University Madrid, Spanien

Bernd Gebhard,
BMW, München, Deutschland

Marcela Genero,
University of Castilla-La Mancha, Spanien

Nadine Hanebutte,
University of Idaho, USA

Hans-Georg Hopf,
GSO-Fachhochschule, Nürnberg, Deutschland

Mohammad Kassab,
Concordia University, Montréal, Kanada

Martin Kunz,
Gruner+Jahr, Hamburg, Deutschland

Marek Leszak,
Alcatel-Lucent Deutschland, Nürnberg, Deutschland

Claus Lewerentz,
TU Cottbus, Deutschland

Peter Liggesmeyer,
Fraunhofer IESE, Kaiserslautern, Deutschland

Mathias Lothar,
Robert Bosch GmbH, Stuttgart, Deutschland

Roberto Meli,
DPO, Rom, Italien

Dirk Meyerhoff,
Schüco-Service GmbH, Bielefeld, Deutschland

Jürgen Münch,
Fraunhofer IESE, Kaiserslautern, Deutschland

Olga Ormandijeva,
Concordia University, Montréal, Kanada

Frances Paulisch,
Siemens AG, München, Deutschland

Luca Santillo,
ISMA, Rome, Italien

Khalid Al Sarayreh,
ETS Montreal, Kanada

Andreas Schmietendorf,
Berlin Hochschule für Wirtschaft, Deutschland

Harry Sneed,
SES München/Budapest, Deutschland/Ungarn

Charles Symons,
Software Measurement Service Ltd, Edenbridge, UK

Hannu Toivonen,
Nokia Siemens Networks, Finland

Sylvie Trudel,
Pyxis Technology, Montréal, Kanada

Cornelius Wille,
FH Bingen, Deutschland

Horst Zuse,
Technische Universität Berlin, Deutschland

Kontakt

DASMA e.V.: Katja Sons (Tel. +49 – 211 – 54 26 97 70, info@dasma.org)

Uni Magdeburg: Dagmar Dörge (Tel. +49 – 391 – 67 18 664, doerge@ivs.cs.uni-magdeburg.de)

Weitere Informationen (einschließlich MetriKon-Richtlinien für Autoren und Vorlagen)

<http://www.dasma.org>

<http://iws2010.cs.uni-magdeburg.de>

<http://www.metrikon.de>